附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组别 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
|  | 第一组 | 工信厅科函[2021]234号2021-1248T-YS | 锗行业绿色工厂评价要求 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0471T-YS | 区熔锗锭安全生产规范 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]41号20214648-T-469 | 高纯镓 | 有研国晶辉新材料有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0082T-YS | 高纯铟 | 云南锡业集团控股有限责任公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0083T-YS | 高纯铟化学分析方法 第 1部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0084T-YS | 红外及激光材料用硒化氢 | 广东先导稀材股份有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]158号2022-0573T-YS | 半绝缘砷化镓单晶衬底片 | 广东先导微电子科技有限公司 | 讨论 |
|  | 第二组 | 国标委发[2021]41号20214650-T-469 | 硅中代位碳含量的红外吸收测试方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]19号20211956-T-469 | 半导体晶片表面金属沾污的测定 全反射X射线荧光光谱法 | 有研半导体材料有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0249T-YS | 颗粒硅表面粉尘含量的测定 浊度法 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0108T-YS | 改良西门子法多晶硅用硅芯 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0110T-YS | 硅片包装和标志 | 浙江海纳半导体有限公司 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]94号2022-0111T-YS | 晶片包装片盒表面颗粒的测试 液体颗粒计数法 | 麦斯克电子材料股份有限公司 | 讨论 |